

# 목원대 IP서비스 아카데미 커 / 리 / 클 / 럽

▶ 교육기간 : 2017년 7월 3일 ~ 2017년 7월 12일 (8일) / 교육시간 : 1일 6시간

▶ 교육장소 : 목원대학교 내 강의실(추후안내)

일	시간	교육주제	교육내용
1일차 (7/3)	9:40~10:00	OT	- 교육과정 안내 및 오리엔테이션
	1~3교시 10:00~13:00	특허제도의 이해	- 특허제도의 이해 - 특허요건 및 절차의 이해
	13:00~14:00	점심시간	
	4~6교시 14:00~17:00	특허명세서의 이해	- 특허명세서의 구성과 각 항목의 이해 - 특허 청구범위 이해 및 작성 방법
2일차 (7/4)	1~3교시 10:00~13:00	주요국 공공 특허 DB의 이해	- 주요국 공공 특허 DB의 특징 - KIPRIS(한국), USPTO(미국), J-Platpat(일본), ESPACENET(유럽) 등
	13:00~14:00	점심시간	
	4~6교시 14:00~17:00	민간 특허 DB의 이해	- IP정보조사 툴 소개 및 실습 - 인명정보를 이용한 실전검색 - 번호정보를 이용한 실전 검색
3일차 (7/5)	1~3교시 10:00~13:00	검색 실습	- 연산자 및 키워드 추출 방법 소개 - 키워드 검색식을 이용한 실전검색 - 국가별 특허분류코드를 이용한 실전검색
	13:00~14:00	점심시간	
	4~6교시 14:00~17:00	IP 선행기술조사의 목적 및 실습	- IP 선행기술조사의 목적 - 청구항의 구성요소 분해 실습 - 동일성/용이성 판단 실습 - IP선행기술조사 보고서 작성실습

4일차 (7/6)	1~3교시 10:00~13:00	그룹별 프로젝트 실습(1)	- 기술 내용 파악 - 기술별 검색식 작성 실습
	13:00~14:00	점심시간	
	4~6교시 14:00~17:00	그룹별 프로젝트 실습(2)	- 선행기술조사 실습 - 선행기술조사 보고서 작성 실습
5일차 (7/7)	1~3교시 10:00~13:00	IP 분석 개요 및 IP 정량분석 준비작업 실습	- IP 분석의 개요 및 절차 - 기술트리 및 키워드 작성 - 정보수집 및 유효데이터 추출 - 피벗테이블 사용방법
	13:00~14:00	점심시간	
	4~6교시 14:00~17:00	IP 정량분석 실습	- 전체 특허동향 분석 실습 - 출원인(주요 연구그룹)별 특허동향분석 실습 - 기술분야별 특허동향 분석 실습
6일차 (7/10)	1~3교시 10:00~13:00	IP 정성분석	- IP 정성분석의 이해 - 주요 방법을 이용한 핵심특허 추출 및 실습 - 기술발전도 및 인용맵의 이해
	13:00~14:00	점심시간	
	4~6교시 14:00~17:00	IP 분쟁대응의 이해	- IP 분쟁대응의 중요성 - 특허소송 절차 - 라이선스 협상

7일차 (7/11)	1~3교시 10:00~13:00	IP 거래의 개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IP 거래의 정의 및 프로세스</li> <li>- IP 거래를 위한 관련 법령 소개</li> <li>- IP 거래 업계의 현황 등</li> </ul>
		IP 거래 Planning	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IP 거래 기획의 중요성 및 목적</li> <li>- 공급기술 및 수요기업 발굴 방법</li> <li>- 대상기술의 비즈니스 모델 개발 방법</li> </ul>
	13:00~14:00	점심시간	
	4~6교시 14:00~17:00	IP 거래 Marketing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IP 거래를 위한 마케팅 전략 수립</li> <li>- 기술요약서 및 SMK 작성 요령</li> </ul>
IP 거래 기술 Valuation		<ul style="list-style-type: none"> <li>- IP 거래 기술의 기술성, 권리성, 시장성 평가 및 등급산출 방법</li> <li>- IP 기술 가치평가 및 분석 방법</li> <li>- 특허 활용전략 수립</li> </ul>	
8일차 (7/12)	13:00~13:20	수료식	- 우수교육생 시상 및 교육 수료식
	13:30~17:30	자격검정시험	- IP정보검색사 자격 검정시험